



УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «Гиредмет»

Ю.Н. Пархоменко

«18» января 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Центре коллективного пользования научным оборудованием— «Центр коллективного пользования Испытательный аналитико- сертификационный центр ГИРЕДМЕТА» (ЦКП-ИАСЦ ГИРЕДМЕТА)

1 Центр коллективного пользования Испытательный аналитико-сертификационный центр ГИРЕДМЕТА, именуемый в дальнейшем ЦКП-ИАСЦ ГИРЕДМЕТА, образован в соответствии с Приказом № 56а от 09 октября 2000 г. на базе института ГИРЕДМЕТ (далее – Институт).

2 Местонахождение и почтовый адрес ЦКП-ИАСЦ ГИРЕДМЕТА:

119017 Москва, Б. Толмачевский пер., 5 стр.1

Телефон/факс: (495) 953-87-91.

e-mail: analytica@giredmet.ru

3 ЦКП-ИАСЦ руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Института.

4 Основными направлениями деятельности ЦКП-ИАСЦ ГИРЕДМЕТА является обеспечение проведения исследований на имеющемся оборудовании, а также оказание услуг исследователям и научным коллективам как Института, так и иным заинтересованным пользователям.

5 Основными целями и задачами ЦКП-ИАСЦ являются:

– выполнение крупных фундаментальных, поисковых, прикладных и инновационных проектов;

- расширение возможности использования имеющегося уникального и дорогостоящего аналитического оборудования;
- усиление связи с предприятиями металлургического комплекса России;
- оказание методической и консультационной помощи заводским лабораториям;
- позиционирование ЦКП-ИАСЦ в качестве международного аналитико-сертификационного центра;
- расширение обучающих функций ЦКП-ИАСЦ.

6 Основным направлением деятельности ЦКП-ИАСЦ является осуществление исследований, проводимых для решения задач, определенных приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации и перечнем критических технологий Российской Федерации: «Индустрия наносистем и материалов», «Информационно-телекоммуникационные системы», «Перспективные вооружения, военная и специальная техника», «Рациональное природопользование», «Транспортные, авиационные и космические системы» и критическим технологиям: «Нанотехнологии и наноматериалы», «Технологии создания биосовместимых материалов», «Технологии создания и обработки композиционных и керамических материалов», «Технологии создания и обработки кристаллических материалов», «Технологии создания и обработки полимеров и эластомеров», «Технологии создания мембран и каталитических систем», «Технологии создания новых поколений ракетно-космической, авиационной и морской техники», «Технологии создания электронной компонентной базы».

7 Структура ЦКП-ИАСЦ

ЦКП-ИАСЦ как внеструктурная единица Института имеет три подразделения по видам выполняемых исследований и предоставляемых услуг:

- Подразделение по стандартизации, метрологии, сертификации и контролю химического состава веществ и материалов;
- Подразделение по физическим исследованиям;
- Подразделение по диагностике структуры и физических свойств полупроводниковых материалов и эпитаксиальных структур.

Подразделение по стандартизации, метрологии, сертификации и контролю химического состава веществ и материалов сформировано на основе научно-производственного комплекса качества и аналитики ОАО «ГИРЕДМЕТ» (НПК-3) и включает три научно-исследовательских лаборатории, сформированные по принципу использования той или иной группы методов анализа, и лабораторию метрологии. В число научно-исследовательских лабораторий входят:

- лаборатория физико-химических методов анализа;
- лаборатория масс-спектрометрических методов анализа и экоаналитики;
- лаборатория спектральных методов анализа.

Подразделение по физическим исследованиям сформировано на базе Научно - производственного комплекса НПК-2 и включает две научно-исследовательских лаборатории. В их число входят:

- лаборатория физико-технологических методов исследования полупроводниковых материалов;
- лаборатория физико - химических методов исследования полупроводниковых наноматериалов.

Подразделение по диагностике структуры и физических свойств полупроводниковых материалов и эпитаксиальных структур сформировано на базе Научно-производственного комплекса НПК-2. В подразделение входит лаборатория структурно-технологических исследований полупроводниковых материалов.

8 Материально-техническая база ЦКП-ИАСЦ многообразна. Перечень оборудования ЦКП-ИАСЦ приведен в Приложении А. Перечень оборудования уточняется ежегодно.

9 Финансирование деятельности ЦКП-ИАСЦ осуществляется в рамках выполнения государственных контрактов, различного рода грантов, иных источников, не противоречащих законодательству.

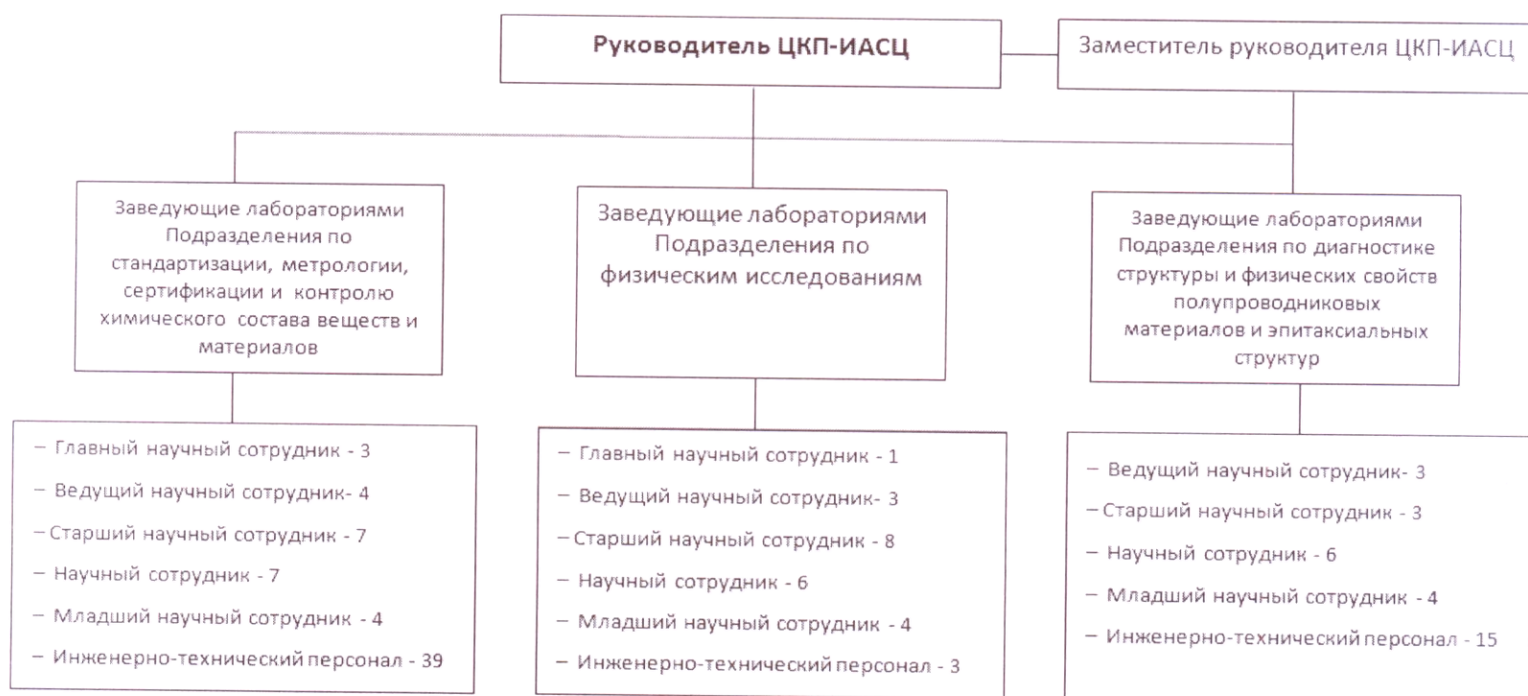
10 ЦКП-ИАСЦ использует средства на достижение целей и решение задач, предусмотренных настоящим Положением.

11 Организация деятельности ЦКП-ИАСЦ:

11.1 Руководство деятельностью ЦКП-ИАСЦ осуществляет руководитель ЦКП-ИАСЦ, назначаемый директором Института.

Должностные обязанности и функции руководителя и персонала ЦКП-ИАСЦ определяются должностными инструкциями.

Структура штатного расписания ЦКП-ИАСЦ:



Руководитель ЦКП-ИАСЦ подчиняется заместителю директора Института по науке и качеству.

Лаборатории, входящие в состав ЦКП-ИАСЦ, подчиняются руководителю структурного научно-производственного комплекса и в сфере их компетенции в рамках ЦКП-ИАСЦ – руководителю ЦКП-ИАСЦ и его заместителю.

11.2 Штатный состав ЦКП-ИАСЦ соответствует штатному расписанию подразделений Института, входящих в ЦКП-ИАСЦ.

12 Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг ЦКП-ИАСЦ определяет директор Института в соответствии с дейст-

вующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.1 Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе.

12.2 Проведение ЦКП-ИАСЦ научных исследований и оказание услуг на возмездной основе заинтересованным пользователям осуществляется на основе договора между организацией-заказчиком и Институтом.

13 Контроль за осуществлением деятельности ЦКП-ИАСЦ осуществляет заместитель директора Института по науке и качеству.

14 Прекращение деятельности ЦКП-ИАСЦ осуществляется в установленном порядке на основании приказа директора Института.

Руководитель ЦКП-ИАСЦ Гиредмета,
член-корр. РАН



Ю.А. Карпов

**Перечень научного оборудования, закрепленного за
ЦКП-ИАСЦ ГИРЕДМЕТА**

- 1 Просвечивающий электронный микроскоп 200СХ, JEOL, Япония, 1998.
- 2 Сканирующий электронный микроскоп SEM-515, Phillips, Голландия, 1999.
- 3 Установка измерения сопротивления растекания ASR-100С, SSM, США, 1996.
- 4 Оптические микроскопы Polivar-Met и MeF3, Reichert-Jung, Австрия, 1996.
- 5 Универсальный исследовательский микроскоп Olympus BX51M, Olympus, Япония 2008.
- 6 Стереомикроскоп Olympus B061, Olympus, Япония, 2007.
- 7 Рентгеновские топографические камеры, Rigaku Denki, Япония, 1986.
- 8 Рентгеновский дифрактометр ДРОН-2, НПО "Буревестник, Россия, 1995.
- 9 Установка для механических испытаний монокристаллов и пластин кремния в режиме статического нагружения, ОМЗ Гиредмета, Россия, 1985.
- 10 Автоматизированный микротвердомер "Miniload-2", Lietz, Германия, 1986.
- 11 Рентгеновский микроанализатор состава Камебакс-Микробим, Самеса, Франция, 1996.
- 12 Фотоэлектронный и Оже-спектрометр Эсхалаб МК-II, VG, Англия, 1996.
- 13 Оптический Фурье- спектрометр, Bruker, Германия, 2000.
- 14 Атомно-силовой и туннельный микроскоп АСМ, ИТЭФ, Россия, 2004.
- 15 Рамановский спектрометр Т 64000 HORIBA, Jobin Yvon, Франция, 2007.
- 16 Установка Jetlab II, MicroFab Technologies Inc., США, 2007.

17 Инвертированный моторизованный флуоресцентный микроскоп исследовательского класса Olympus IX81, Olympus, Япония, 2009.

18 Установка искрового плазменного спекания DR.SINTER Lab Model SPS-511S, SPS Syntex Inc., Япония, 2009.

19 Рентгеновский фотоэлектронный спектрометр с построением изображения для фундаментальных и прикладных исследований полупроводниковых материалов Axis UltraDLD, Kratos Analytical Limited, Великобритания, 2008.

20 Рентгенофлуоресцентный спектрометр с разрешением по длине волны ARL Optim'X, Applied Research Laboratories, Швейцария, 2006.

21 Анализатор энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный Innov-X - X-50, Innov-X Systems Inc., США, 2008.

22 Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор α -Series, Innov-X Systems Inc., США, 2008.

23 Масс-спектрометр искровой JMS 01B2, JEOL, Япония, 1998.

24 Микроденситометр автоматический MDM-6, Oxford Instruments, Англия, 1982.

25 Масс-спектрометр высокого разрешения с ионизацией в тлеющем разряде Finnigan Element GD, Thermo Electron Corp., США, 2008.

26 Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой XSeries 2, Thermo Scientific, США, 2011.

27 Плазменный спектрометр JY 38, Jobin Yvon, Франция, 1978.

28 Спектрометр с индуктивно связанной плазмой, атомно-эмиссионный iCAP 6300 Radial View. MFC., Thermo Electron Corp., США, 2007.

29 Атомно-абсорбционный спектрометр высокого разрешения с источником сплошного спектра ContrAA 600, Analytikjena, Германия, 2013.

30 Двухлучевой атомно-абсорбционный спектрофотометр GBC Sens Dual, GBS, Австралия, 2006.

31 Атомно-абсорбционный спектрофотометр Z 3030, Perkin Elmer, США, 1996.

32 Малогабаритный многоканальный спектрометр «Колибри-2», ООО «ВМК-Оптоэлектроника», Россия, 2011.

33 Дуговой спектрометр с многоканальным анализатором эмиссионных спектров ДФС-МАЭС, ЛОМО – ВМК-Оптоэлектроника, Россия, 2004.

34 Многоканальный спектрометр высокого разрешения «Гранд», ООО «ВМК-Оптоэлектроника», Россия, 2013.

35 Анализатор азота, кислорода и водорода LECO ONH 836, LECO, США, 2012.

36 Анализатор серы и углерода LECO CS 844, LECO, США, 2013.